Anno 2013

Politecnico di BARI >> Sua-Rd di Struttura: "Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione"

C.1.b Grandi attrezzature di ricerca[1]

N.1 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Stazione per la saldatura e lavorazione di fibre ottiche
Responsabile scientifico	PRUDENZANO Francesco
Descrizione[2]	Stazione per la saldatura e lavorazione di fibre ottiche Splicer Vytran GPX PTR Fiber Optic Glass Processing Unit Stazione per il rivestimento di fibre ottiche Vytran PTR Fiber Optic Recoater Fiber Optic Recoater
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2013
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.2 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Camera anecoica
Responsabile scientifico	PRUDENZANO Francesco
Descrizione[2]	Camera anecoica con sistema completo per la caratterizzazione di antenne sino a 18 GHz StarLab Antenna Test Station (SL18): 800 MHz to 18 GHz . Stazione di prototipazione di circuiti PCB ed a microonde. LPKF ProtoLaser U3 for Rapid PCB Prototyping: accuracy 2 µm
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2013
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.3 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Impianto di metallizzazione
Responsabile scientifico	PRUDENZANO Francesco
Descrizione[2]	Impianto di metallizzazione. LPKF Electroplating of Through-Holes Pressa per la produzione di circuiti stampati multilayer (sino ad otto layer) LPKF MultiPress S: Press for Producing Multilayers (up to 8 layers)

Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2013
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.4 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Strumentazione per campi elettromagnetici
Responsabile scientifico	PRUDENZANO Francesco
Descrizione[2]	Misuratore campo elettromagnetico MPB AF e BF Analizzatore di reti Agilent N5224A PNA Microwave Network Analyzer: 10 MHz to 43.5 GHz, 2-ports, time domain option Ricevitore EMI + analizzatore di spettro. R&S ESU EMI Test Receiver: standard-compliant EMI test receiver + high-end spectrum analyzer, 20 Hz to 26.5 GHz, full compliance with CISPR 16-1-1 standard Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN line impedance stabilization network) R&S ENV216 LISN two-line V-network for disturbance voltage measurements on single-phase EUTs: 9 kHz to 30 MHz, Power-handling capacity up to 16 A, constant current. Generatore di segnale RF. R&S SMB100A RF and Microwave Signal Generator: 100 kHz to 20 GHz, AM, FM and Pulse modulator, Pulse generator, Pulse train Analizzatore di spettro. R&S FSL Spectrum Analyzer: 9 kHz to 18 GHz (over range 20 GHz), resolution bandwidth 1 Hz. Analizzatore di spettro e di reti portatile sino a 3 GHz. R&S FSH3 handheld Spectrum Analyzer: 100 kHz to 3 GHz, resolution bandwidth 1 Hz, distance to fault measurement option, two-port measurements with tracking generator R&S HL050 Antenna: Log-Periodic Directional Antenna for linear polarization: 850 MHz to 26.5 GHz R&S HF907 Antenna: Double-Ridged Waveguide Horn Antenna: broadband directional antenna for EMC measurements: 0.8 GHz to 18 GHz- R&S HL040 Antenna: Log-periodic broadband antenna: 400 MHz to 3 GHz input impedance Sonde di Campo e.m vicino. Near field probes: active broadband probes for EMI diagnosis for frequencies of up to 1 GHz, H-field probe, High-impedance probe, E-field probe Stazione di monitoraggio elettromagnetico. Narda Area Monitor System 2600: Remote Monitoring of Electromagnetic Fields; E-field 100 kHz÷7 GHz, H-field 5 Hz÷100 kHz Misuratore di campo elettromagnetico. Narda 8053-2004/40 portable EM fields meter: E-field 100 kHz÷7 GHz, H-field 5 Hz÷400 kHz Analizzatore di reti portatile. VNA portatile Agilent 30KHz a 18GHz Sonde per la misura della costante dielettrica Dielectric probe kit SPEAG 10MHz-50GHz Stazione Saldante Weller Banco ottico dotato microposizionatori e componentistica da banco Laser in fibra ottica ad itterbio CW da 30 W Laser in fibra ottica ad itterbio CW da 100 W Liekky Alimentatore Sorensen Sistema di diagnostica della qualità M2 di fascio laser - Nanoscan Telecamera ad infrarossi per rilevamento campo IR - Amplificatore EDFA Spettrometri UV-VIS Microscopio ottico OPTICA SZM Analizzatore di spettro ottico R&S OSA 350 - 1000 nm, resolution up to 1 pm; Fast sweep time; max livello di input: ± 10 dBm 2 Workstation HP Z830, 1 computer HP Z420, 3 computer HP Z220, PC portatili etc.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2013
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.5 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Camera schermata
Responsabile scientifico	D'ORAZIO Antonella, PETRUZZELLI Vincenzo
Descrizione[2]	Camera schermata 3x7x3 m3 corredata di tuner metallico e stirrer e dotata di LISN Comtest 9 kHz-30 MHz, Antenne biconiche, a tromba; Generatore di forme donda; Generatore di scariche elettrostatiche, Ricevitore per misure EMI 9 kHz 2.8 GHz, Scan EM probes mod. CTK015 della CredenceTechn, Sensore di campo elettrico triassiale con elevata velocità di acquisizione ed uscita in fibra ottica e scheda acquisizione da PC, Sensore di temperatura in fibra ottica, Coppia di antenne log-periodiche (tipicamente 200 MHz -1 GHz), Coppia di antenne double-ridge (tipicamente 1-18 GHz), Antenne biconiche e a tromba, Amplificatori di potenza, High-Temperature Dielectric Probe Kit Agilent Technologies 85070C; RF Network Analyzer (T/R), 300 kHz to 3 GHz HP 8714E, Misuratore di campo e sonda isotropa 5 Hz-100 kHz PMM più sonde AF e BF, Misuratore di campo Wandel&Goltermann con sonde F-0010, M-0002, T-0005, S-0028, ComtestSentinel, Analizzatore di spettro Advantest R3131 9 kHz-3 GHz, Cella GTEM per esperimenti dosimetrici in vitro.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2000
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.6 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Clean room
Responsabile scientifico	PETRUZZELLI Vincenzo
Descrizione[2]	Camera pulita in classe 100-1000 dotata di cappa chimica, Spin coater Laurell WS-400BZ-6NPP/LITE, Sputtering DC AC.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Interni
Anno di attivazione della grande attrezzatura	1999
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.7 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Sistema di caratterizzazione per la Microelettronica
Responsabile scientifico	CORSI Francesco, MARZOCCA Cristoforo
Descrizione[2]	Sistema di caratterizzazione a micropunte semiautomatico (Karl Suss PM8) completo di Semiconductor parameter analyzer, HP4155, C-V plotter, 4280A HP e microscopio ottico metallografico (Karl Zeiss Axioskope) con telecamera e monitor.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Interni, Regionali/Nazionali, Altri Fondi

Anno di attivazione della grande attrezzatura	2005
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.8 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Strumentazione del Laboratorio di Elettronica per le Telecomunicazioni
Responsabile scientifico	AVITABILE Gianfranco
Descrizione[2]	Analizzatore di spettro Agilent - E4407B (4GHz). Generatore di segnali Vettoriale Agilent - MXG N5182A (6GHz). Generatore di segnali Agilent - E4433B (26.5GHz). Analizzatore di reti vettoriale con sistema di calibrazione automatica Agilent - N5242A (26.5 GHz). Analizzatore di segnali Agilent - EXA N9010A (26.5GHz)+ software d'analisi mod. 89601°+ misuratore rumore di fase + qualifica per apparati RFID. Software per progettazione CAD ad alta frequenza, comprensivo di tutti i moduli, Agilent ADS (5 licenze). Software per progettazione CAD CADENCE con modulo ASSURA per DRC (3 licenze).
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali, Altri Fondi
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2004
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.9 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Laboratorio tecnologico
Responsabile scientifico	CIMINELLI Caterina
Descrizione[2]	Laboratorio tecnologico equipaggiato con bagno termostatato per lo scambio protonico, macchine per il taglio e la lucidatura dei cristalli, apparato per il Reactive ion etching, termometro digitale, bilancia di precisione, spinner.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Interni, Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	1999
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.10 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Laboratorio di caratterizzazione ottica
Responsabile scientifico	CIMINELLI Caterina

Descrizione[2]	Laboratorio di caratterizzazione ottica equipaggiato con un banco per la caratterizzazione di guide donda ottiche con misura dellattenuazione e dello scattering nel piano, un banco ottico per la caratterizzazione di strutture in scala micro e nanometrica, sorgenti laser a 454, 457, 465, 476, 488, 496, 501, 514, 532, 633, 1150 e 1530 nm, una sorgente laser accordabile a 1550 nm, un lock-in amplifier. Banco olografico equipaggiato con laser di potenza che emette nel verde.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Interni, Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	1999
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

N.11 - Ad uso esclusivo della struttura (scheda inserita dalla Struttura)

Nome o Tipologia	Sistema per la sintesi e la caratterizzazione di materiali ottici
Responsabile scientifico	PETRUZZELLI Vincenzo
Descrizione[2]	Sistema per la sintesi e la caratterizzazione di film ottici costituito da: 3D Profilometer Dektak 150, Ellipsometer (range 400 800 nm, 1mm) MM-16 della Horiba Jobin Yvon, System Microscope Olympus BX51, Ocean Optics HR4000.
Classificazione ESFRI[3]	Physical Sciences and Engineering
Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto[4]	Regionali/Nazionali
Anno di attivazione della grande attrezzatura	2010
Utenza	Interna allateneo, Esterna allateneo
Applicazioni derivanti dallutilizzo dellattrezzatura	Progetti di ricerca, Collaborazioni scientifiche, Prestazioni a tariffario, Contratti di ricerca
Altre informazioni utili[5]	
Area Scientifica di Riferimento:	09

(1) Si intendono le sole attrezzature a fini di ricerca e di elevato livello di specializzazione; il valore è tipicamente superiore a 100.000 euro (intesi complessivamente, per lintera attrezzatura); il periodo di acquisizione/utilizzo deve coincidere almeno in parte con l'anno di riferimento. L'aspetto economico di dettaglio viene eventualmente trattato nel quadro III missione. Qui indicare solo l'aspetto scientifico. Vanno mappate anche le attrezzature nella disponibilità dellateneo (attraverso eventuali comodati ad es. con imprese o in virtù di accordi di accesso), e non solo quelle di proprietà dellateneo. Censire anche le risorse per il calcolo elettronico solo se di particolare rilievo

(2) Descrizione: indicare se è associata a uno/più Gruppi di ricerca; indicare anche se esiste un collegamento con laboratori o centri di ricerca.

(3) Classificazione ESFRI: Alberatura versione 2012 (la versione 2013 non è attualmente disponibile).

(4) Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto.

(5) Altre informazioni utili: Ricadute scientifiche di particolare rilievo collegabili all'attrezzatura durante l'anno in corso. Es.: progetti, pubblicazioni, invenzioni, esperimenti, brevetti, privative etc.